

## Testowanie hipotez - podstawowe informacje

Niech  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  będzie próbą losową na przestrzeni  $\mathcal{X}$ , zaś  $\mathcal{P} = \{P_\theta, \theta \in \Theta\}$  rodziną rozkładów prawdopodobieństwa określonych na przestrzeni prób  $\mathcal{X}$ .

Będziemy zakładać, że mamy do czynienia z *hipotezami parametrycznymi*, tzn. z hipotezami dotyczącymi wartości nieznanego parametru  $\theta \in \Theta$  rozkładu (np. wartości oczekiwanej, wariancji itd).

**Definicja 1.** *Hipotezę zerową* nazywamy hipotezę  $\theta \in \Theta_0 \subset \Theta$ , której prawdziwość chcemy zweryfikować na podstawie obserwacji. Hipoteza alternatywna jest postaci  $\theta \in \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$ .

*Hipoteza prosta* to hipoteza, której odpowiada jedna wartość, np.  $H_0: \theta = 2$ , *hipoteza złożona* to hipoteza, której odpowiada więcej niż jedna wartość, np.  $H_0: \theta > 4$ .

**Definicja 2.** *Obszar krytyczny testu* jest obszarem odrzucenia hipotezy zerowej. Najczęściej ma on postać  $K = \{\mathbf{X} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{X}) > c\}$ , gdzie  $c$  jest *poziomem krytycznym testu*, wyznaczonym przez kwantyl rozkładu, z którego pochodzi statystyka testowa przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej (zależy on od przyjętego poziomu istotności testu  $\alpha$ ).

**Podsumowując, aby przeprowadzić test statystyczny, musimy mieć:**

1. hipotezę zerową  $H_0$  i hipotezę alternatywną  $H_1$ ,
2. poziom istotności  $\alpha \in (0, 1)$  - bardzo mała liczba, np. standardowo 0,05,
3. statystykę testową  $T(\mathbf{X})$ ,
4. obszar krytyczny  $K$ .

**Decyzja:** jeżeli  $T(\mathbf{X}) \in K$ , to odrzucamy hipotezę  $H_0$ , jeżeli  $T(\mathbf{X}) \notin K$ , to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy  $H_0$ .

**Definicja 3.** *P-wartość (p-value)* to graniczny poziom istotności - najmniejszy, przy którym zaobserwowana wartość statystyki testowej prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej.

Jest to więc taki poziom istotności, przy którym zmienia się decyzja testu (zwiększając poziom istotności testu  $\alpha$  od zera: najpierw dla najmniejszych poziomów istotności nie mamy podstaw do odrzucenia  $H_0$ , a później, po przekroczeniu  $p$ -wartości, zaczynamy odrzucać  $H_0$ ).

$P$ -wartość pozwala bezpośrednio ocenić wiarygodność hipotezy: im  $p$ -wartość jest większa, tym bardziej hipoteza  $H_0$  jest prawdziwa. Mała  $p$ -wartość świadczy przeciwko hipotezie zerowej.

Znajomość  $p$ -wartości pozwala przeprowadzić testowanie dla dowolnej wartości  $\alpha$ :  
-odrzucaamy  $H_0$ , gdy

$$p\text{-wartość} \leq \alpha,$$

-nie mamy podstaw do odrzucenia  $H_0$ , gdy

$$p\text{-wartość} > \alpha.$$

### Testy $t$ -Studenta

Są to parametryczne testy istotności dla jednej lub dwóch prób, polegające na testowaniu hipotez dotyczących **wartości oczekiwanych**.

- W przypadku jednej próby zawierającej realizacje zmiennej losowej  $X$  testujemy równość jej wartości oczekiwanej  $\mathbb{E}X = \mu$  pewnej ustalonej liczbie  $\mu_0$ .
- W przypadku dwóch prób zawierających realizacje zmiennych  $X$  oraz  $Y$  testujemy równość ich wartości oczekiwanych  $\mathbb{E}X = \mu_1$  oraz  $\mathbb{E}Y = \mu_2$ .

Zakładamy, że pomiary podlegają rozkładowi normalnemu, lub mają dowolny rozkład o ile ich liczebności są dość duże (z reguły  $n > 30$  w przypadku jednej próby oraz  $n_1, n_2 \geq 100$  w przypadku dwóch prób). Czasami też się zakłada, że wariancje w próbach nie różnią się od siebie istotnie, ale to założenie można ominąć wprowadzając korektę.

#### 1. Test $t$ -Studenta dla jednej próby

- Hipotezy

$$H_0 : \mu = \mu_0, \tag{1}$$

$$H_1 : \mu > \mu_0, \tag{2}$$

$$\mu < \mu_0, \tag{3}$$

$$\mu \neq \mu_0 \tag{4}$$

- Statystyka testowa

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu_0}{s},$$

gdzie  $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$  to próbkowe odchylenie standardowe.

- Obszar krytyczny zależy od postaci hipotezy alternatywnej w następujący sposób:

$$K_1 = (F_{t_{n-1}}^{-1}(1 - \alpha), +\infty), \tag{1}$$

$$K_2 = (-\infty, -F_{t_{n-1}}^{-1}(1 - \alpha)), \tag{2}$$

$$K_3 = (-\infty, -F_{t_{n-1}}^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})) \cup (F_{t_{n-1}}^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2}), +\infty), \tag{3}$$

gdzie  $F_{t_{n-1}}^{-1}(a)$  to kwantyl rzędu  $a$  rozkładu  $t$ -Studenta z  $(n - 1)$  stopniami swobody. Jeżeli wariancja rozkładu jest znana, wówczas  $s$  zastępujemy przez odchylenie standardowe  $\sigma$  rozkładu, zaś  $F_{t_{n-1}}^{-1}(a)$  zastępujemy przez  $\Phi^{-1}(a)$  ( $\Phi$  - dystrybuanta rozkładu standardowego normalnego  $N(0, 1)$ ).

## 2. Test $t$ -Studenta dla dwóch prób niezależnych

- Hipotezy

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

- Statystyka testowa

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}},$$

gdzie

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)},$$

$s_1, s_2$  to odchylenia standardowe z próbek, zaś  $n_1, n_2$  to liczebności próbek.

- Obszar krytyczny

$$K = \left( -\infty, -F_{t_{n_1+n_2-2}}^{-1} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \right) \cup \left( F_{t_{n_1+n_2-2}}^{-1} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right), +\infty \right)$$

## 3. Test $t$ -Studenta dla dwóch prób zależnych

- Hipotezy

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2, \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

- Statystyka testowa

$$T = \frac{\bar{d}}{s_{\bar{d}}},$$

gdzie

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i,$$

$$d_i = x_{1i} - x_{2i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

$$s_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2},$$

zaś  $x_{1i}, x_{2i}$  oznaczają wartości cechy  $X$  dla  $i$ -tego obiektu w pierwszym i drugim badaniu.

- Obszar krytyczny

$$K = \left( -\infty, -F_{t_{n-1}}^{-1} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right) \right) \cup \left( F_{t_{n-1}}^{-1} \left( 1 - \frac{\alpha}{2} \right), +\infty \right)$$

**Uwaga:** Gdy liczebność próby jest duża (większa od 30), kwantyl rozkładu  $t$ -Studenta można zastąpić odpowiednim kwantylem rozkładu standardowego normalnego.

W przypadku dwóch prób możliwe jest testowanie hipotez jednostronnych postaci  $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ ,  $H_1 : \mu_1 < \mu_2$ . Wówczas, analogicznie jak w przypadku 1, zmieniają obszary krytyczne.